

(講習会)

信頼性解析と故障解析

項目	内容
ご案内	電子機器の品質保証は、製品開発の段階から考慮されるべき重要な項目です。当研修では、電子機器・部品の信頼性試験の方法および寿命の推定法等について解説いたします。また、故障事例を紹介し、故障診断装置を用いて実践的解析手法を学習いたします。信頼性、品質管理や故障解析等に興味をお持ちの方、現場でトラブルにお悩みの方、お気軽に受講して下さい。
開催期間	平成21年9月29日(火)～9月30日(水) 日数:2日
会場	地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター(西が丘本部)
応募資格	原則として都内中小企業の方 都外の方でも東京に本社、事業所等があれば応募できます。
定員	20名
受講料	9,000円(消費税込み)
申込方法	受講申込書に所定事項をご記入の上、FAX、郵送、直接持参又は電子メールでお申し込み下さい。 電子メールによるお申し込みの方法は、受講申込書の欄外をご覧ください。
受講の可否	申込締切後、受講予定者には受講料払込書を郵送致します。定員等の関係で受講をお断りする場合は、電話・FAX等にてご連絡いたします。
応募締切	締切日は研修一覧をご覧ください。 定員を超えた場合は期日前に締切ることがあります。
申込先	地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター(西が丘本部) 産業交流室 研修担当 〒115-8586 東京都北区西が丘3-13-10 FAX: 03-3909-2270 TEL: 03-3909-2352 メール宛先: kenshu@iri-tokyo.jp

研修内容

	日時	科目	講師
9月29日 (火)	9:30～12:30	【講習】信頼性概論と環境試験方法	東京都立産業技術研究センター 三上 和正
	13:30～16:30	【講習】FMEA・FTA	安信経営工学研究所 柴田 義文 他2名
9月30日 (水)	9:30～12:30	【講習】電子機器・部品の故障解析	安信経営工学研究所 柴田 義文
	13:30～16:30	【実習】分析機器による故障解析 X線透過装置 IC開封機+赤外線放射温度測定	東京都立産業技術研究センター 河原 大吾、 小林 丈士、豊島 克久